

**Список принятых докладов
Объединённой конференции «Электронно-лучевые технологии и
рентгеновская оптика в микроэлектронике»**

Устные доклады Секция 1. Диагностика полупроводниковых материалов и структур

Докладчик	Название доклада
Вергелес П. С., ИПТМ РАН	Исследование свойств дислокаций в gap методом катодолюминисценции ВРЭМ
Дементьева Е. В., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Определения типа и концентрации ловушек в тонких слоях HfO ₂ .
Якимов Е. Е., ИПТМ РАН	Расширение дефектов упаковки в 4H-SiC при облучении электронным пучком

Стендовые доклады Секция 1. Диагностика полупроводниковых материалов и структур

ФИО докладчика	Название доклада
Гременок В. Ф., НПЦ НАН Беларуси по материаловедению	Preparation and characterization of ZNO films doped by Europium for solar cells
Зарецкая Е. П., ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"	Структурные свойства пленок ZnO:Tb, осажденных золь-гель методом
Манякин М. , ФГБОУ ВО «ВГУ»	Моделирование рентгеновских фотоэлектронных спектров диоксида олова
Мехрабова М. А., Институт Радиационных Проблем НАНА	Влияние γ -излучения на морфологию поверхности эпитаксиальных пленок Cd _{1-x} Fe _x Te ¹
Михайловский В. Ю., СПбГУ	Катодолюминесценция карбида кремния, подвергнутого детонационной обработке
Михеев Н. Н., ЛКМ ИК РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотони	Диагностика полупроводниковых материалов и структур количественными методами РЭМ: спектральной катодолюминесценции и наведенного тока
Наумов А. П., ИПТМ РАН	Пористый кремний с графеновым покрытием для хранения водорода
Пермяков Н. В., СПбГЭТУ "ЛЭТИ"	Исследование проводящих свойств тонких пленок с использованием жидких зондов на основе эвтектического раствора с возможностью варьирования размера
Саенко А. В., ЮФУ, ИНЭП	Исследование электрофизических свойств пленок ИТО для структур солнечных элементов и мемристоров
Старков В. В., ИПТМ РАН	Исследование эффекта зарядовой подкачки в ФЭП структурах
Степович М. А., КГУ им. К.Э.Циолковского	О некоторых математических моделях диффузии неравновесных неосновных носителей заряда, генерированных электронным пучком в полупроводниковой мишени
Томаев В. В., СПГТИ(ТУ)	Особенности структурных и оптических свойств ZnO при глубоком окислении
Томинов Р. В., ЮФУ	Исследование влияние легирования нанокристаллических пленок ZnO на их мемристивные свойства
Уразов К. , ИТКЭ им. Д.В. Сокольского	Электроосажденные тонкие пленки CZTSe
Хусурова Г. М., ИТКЭ им. Д.В. Сокольского	Определение состава и микроструктуры полупроводниковых электродов CuBi ₂ O ₄ модифицированных наночастицами Pt

Устные доклады Секция 2. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ и РЭМ

Докладчик	Название доклада
Загорский Д. Л., ИК РАН	Микроскопия в исследовании нанопроволок различных типов
Коплак О. В., ИПХФ РАН	Формирование высококоэрцитивных микропроводов PrDyFeCoB
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	От метра до нанометра
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Механизмы формирования изображений в РЭМ
Садовская Н. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Применение методов РЭМ и ДСК для исследования изменений надмолекулярной структуры и кристалличности фторполимеров в процессе их растворения/диспергирования в сверхкритических флюидах
Суворова Е. И., ИКАН	Фазовая устойчивость нанокристаллов оксида иттрия Y ₂ O ₃ в сверхпроводящем слое YBCO при облучении ионами ксенона.
Фаррахов Б. Ф., КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН	Incoherent-light pulse annealing of nanoporous germanium layers formed by ion implantation
Чернышев Б. Д., АО "Спецмагнит"	Структурное исследование промышленных постоянных магнитов на основе сплавов системы самарий-кобальт

Стендовые доклады Секция 2. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ и РЭМ

ФИО докладчика	Название доклада
Акберова Э. , ФГБОУ ВО ВГУ	Микроскопический анализ поверхности гетерогенных мембран с разной долей катионообменника
Акимова О. В., МГУ им. М.В. Ломоносова	Особенности изменения рельефа поверхности мембранного диффузионного фильтра в результате взаимодействия с водородом
Аксенов О. И., ИФТТ РАН	Исследование влияния структуры микропроводов на основе железа на их магнитную доменную структуру и свойства
Алекперов Э. Ш., БГУ	Фазовый переход при термообработке аморфных плёнок TlIn _{1-x} Sn _x Se ₂ полученных в электрическом поле
Бешенков В. Г., ИПТМ РАН	Сравнительное сопоставление элементного состава пленок ЦТС, осаждаемых магнетронным распылением в аргоне и ксеноне, по данным рентгеноспектрального микроанализа
Волков Р. Л., НИУ МИЭТ	Электронно-микроскопические исследования структуры и состава нанопроволок германия до и после электрохимического внедрения лития
ГЕЛЕВЕР В. Д., ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АО	Способы детектирования обратнорассеянных электронов в РЭМ
Гостева Е. А., НИТУ МИСиС	Сравнительная оценка токсичности при формировании биологических объектов на поверхности кремниевых структур
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	Возможно ли увеличение информативности электронно-микроскопического исследования ВТСП с помощью Y-модулированного детектирования и анализа сканограмм с использованием дискретного дифференциального оператора на свёртке сепарабельными целочисленными фильтрами?
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	О целесообразности применения гибридных интегральных микросхем и микросборок после специализированной обработки в качестве совместимых с ESEM микрофлюидных субкамер. Опыт аналитической утилизации гибридных топологий
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	К динамическому исследованию поведения фольговых

	тензорезисторов в режимах корреляционной световой и электронной микроскопии ("CLEM"), включая атмосферно-жидкостные техники ("ESEM") и безлинзовую CLEM
Григорьева Д. Д., НИТУ МИСиС	Микроструктура наночастиц карбида железа, полученных левитационно-струйным методом
Гусакова О. В., МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ	Влияние легирования металлами на зеренную структуру и механические свойства быстрозатвердевшего эвтектического силумина
Гусакова О. В., МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ	Образование наноразмерных частиц кремния в силуминах, легированных металлами при высокоскоростном затвердевании
Дерягина И. Л., ИФМ УрО РАН	Особенности расчета по СЭМ изображениям аспектного отношения и плотности интерфейса ниобиевых волокон в микрокомпозите Cu-Nb
Жеребцов Д. Д., ЛАМ	Снижение энергии электронов РЭМ и сглаживание рельефа микрочастиц, как методы повышения точности измерения их элементного состава
Зайцева Ю. С., НИУ МИЭТ	Зернистая структура тонких эпитаксиальных слоев $Ge_2Sb_2Te_5$ на подложке Si(111)
Землякова Н. , ИПМ РАН	Влияние холодного волочения на формирование субструктуры и физических свойств меди М1 после холодной РКУП
Зерница Д. А., УО МГПУ им. И.П. Шамякина	Аннотация
Зыков А. В., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Зависимость матричного элемента электронов с характеристическими потерями энергии от направления вылета электрона L -оболочки атома кремния
Каптелов Е. Ю., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Название доклада
Клименко И. В., ИБХФ РАН	Сравнительное исследование морфологии бескислородного графена, полученного в органической и водно-органической средах, методами ПЭМ и динамического светорассеяния
Кнотько А. В., МГУ	Исследование особенностей формирования материалов низкотемпературного твердения на основе кальций-магний аммонийных фосфатов методами РЭМ и РСМА
Кравец В. А., ФТИ им. А. Ф. Иоффе	Разработка методики оценки радиационной стойкости стекол при облучении электронами средних энергий
Ларионов Ю. В., ИОФ РАН	Ограничения для низковольтного РЭМ в нанометрологии
Малышкина О. В., ТвГУ	Выявление особенностей свойств керамик твердых растворов на основе ниобатов и танталатов с помощью растрового электронного микроскопа
Мараева Е. В., СПбГЭТУ	Исследование композиционных структур на основе гидроксипатита
Маслобоева С. М., ИХТРЭМС КНЦ РАН	Исследование методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией состава и однородности шихты ниобата лития, легированной бором и синтезированной жидкофазным методом.
Митина А. А., ИПТМ РАН	Формирование композиционных слоёв МУНТ/ MnO_2 на поверхности алюминиевой фольги
Митусова К. А., ИВС РАН	Стабилизация наночастиц биогенных элементов бычьим сывороточным альбумином: структура и морфология
Мотылева С. м., ФГБНУ ФНЦ Садоводства	Рэм в решении прикладных и фундаментальных задач плодородства
Никулина А. А., НГТУ	Особенности строения материалов, полученных электроискровым спеканием разнородных сталей

Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Калибровка РЭМ по двум координатам с использованием одногоаттестованного размера
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Измерения на РЭМ размеров рельефных структур в технологическом процессе производства микросхем
Приходько А. С., Национальный исследовательский университет "МИЭТ"	Приготовление образцов планарного сечения атомарно тонких слоев двумерных материалов со связями Ван-дер-Ваальса для электронно-микроскопических исследований
Разбицкая Л. Е., РУДН	Разработка технологии создания наноструктур на основе титана и области их применения
Садовская Н. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Применение методов РЭМ и РСМА для характеристики частиц приземного аэрозоля
Сазонов В. А., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Применение дифракционных картин в сходящемся пучке для определения полярности образцов арсенида галлия
Соколов В. Н., МГУ	Анализ изменения формы структурных элементов при деформировании
Стебельков В. А., НП "Лаборатория анализа микрочастиц"	Применение РЭМ-РМА для совместного исследования образцов разных природы и состава
Степанцов Е. А., ИКРАН	СЭМ исследование поверхности пленки (100)YBa ₂ Cu ₃ O ₇
Сухина Н. С., ИФТТ РАН	Необычная трансформация сферических частиц ПММА под действием электронного пучка микроскопа
Титова А. В., СПбГУ	Электронная микроскопия в палеопалинологических исследованиях
Ткачев В. В., ДВФУ	Структура сплавов типа Fe-Cu-Nb-Si-B с различной концентрацией меди
Трунькин И. Н., НИЦ КИ	Исследование Те- и Са-содержащих образований в ходе испытаний реакторных конструкционных сплавов ХН80МТЮ методами электронной микроскопии
Хантимеров С. М., КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН	Создание слоев нанопористого германия различной морфологии методом ионной имплантации для анодов литий-ионных аккумуляторов
Шепелевич В. Г., БГУ	Микроструктура и свойства быстрозатвердевших сплавов системы Al – Вi для генерирования водорода из воды
Шипко М. Н., ИГЭУ им. В.И.Ленина	О влиянии импульсов слабого магнитного поля на состояние приповерхностного слоя и электромагнитные свойства аморфных ленточных сплавов системы FeSiBLa
Шкалей И. В., ИПМех РАН	Исследование топографии и химического состава поверхности антифрикционных сплавов методом РЭМ
Щербакова Е. Н., БНТУ	Исследование нанокompозита на основе ядра из гидроксиапатита и магнетита методами сканирующей электронной микроскопии
Юшков А. А., УрФУ	Вакуумно напыленные градиентные пленки системы Sb-Te: воздействие пучка в ПЭМ и исследования микроструктуры

Устные доклады Секция 3. Сканирующая зондовая микроскопия и зондовая нанолитография

Докладчик	Название доклада
Анкудинов А. В., ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute)	Механические испытания нанообъектов с помощью атомно-силовой микроскопии
Боднарчук Я. В., ФНИЦ	Микродоменные структуры, созданные электронно-лучевым методом

"Кристаллография и фотоника" РАН	в планарных оптических волноводах на LiNbO_3
Ильина М. В., ЮФУ	Характеризация электромеханических свойств ориентированных углеродных нанотрубок методами атомно-силовой микроскопии
Макарова И. П., ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН	Закономерные связи температурных изменений атомной, реальной структуры и свойств кристаллов-суперпротоников
Толстихина А. Л., ИК РАН	Микроскопия поверхности при фазовых переходах в кристаллах $(\text{NH}_4)_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$
Фомин Л. А., ИПТМ РАН	Описание толщинной зависимости рельефа поверхности эпитаксиальных пленок Мо моделью Кардара-Паризи-Жанга
Чайка А. Н., ИФТТ РАН	Исследование атомной и электронной структуры функционализированного графена на пластинах $\beta\text{-SiC}/\text{Si}(001)$

Стендовые доклады Секция 3. Сканирующая зондовая микроскопия и зондовая нанолитография

ФИО докладчика	Название доклада
Авилов В. И., ЮФУ	Наномемристор на основе электрохимического оксида титана, сформированного методом зондовой литографии.
Атаханов А. А. у., ИХФП АН РУз	Структурные исследования наночастиц целлюлозы методами атомно-силовой микроскопии и рентгеноструктурного анализа
Ашуров Н. Ш., ИХФП АН РУз	Исследование структурных характеристик пленок оксида титана
Баран Л. В., БГУ	Электросиловая микроскопия тонких пленок фуллерит-серебро
Валиев Х. Х., ИПРИМ РАН	Исследования эластомерных композитов с наполнителями на основе диоксида кремния и углерода
Валуева С. В., ИВС РАН	Исследование методами АСМ и ПЭМ структурно-морфологических параметров наночастиц селена и серебра, стабилизированных графт-сополимерами варьируемой топологии
Второва В. С., ГАОУ АО ДО РШТ	Разработка методики формирования элементов и устройств МЭМС на основе метода динамической силовой литографии
Губанова Г. Н., ИВС РАН	Структурно-морфологические особенности нанокompозитов на основе термостойкого полиамидоимида (ПАИ) с силикатными Na-Mg наночастицами
Дементьев П. А., ФТИ им. А.Ф.Иоффе	Математическое описание диссипации зарядов в диэлектриках
Лапега А. В., НГУ	Исследование морфологии поверхности тонких плёнок AlN методом АСМ Исследование морфологии поверхности тонких плёнок AlN методом АСМА.В. Лапега
Лашкова А. К., ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН	Исследование механических свойств слоистых кристаллов ТГС методом атомно-силовой спектроскопии
Морозова А. С., КФТИ им.Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН	Наноразмерные структуры на основе триглицина под действием органических соединений на кремниевых подложках
Новак А. В., НИУ "МИЭТ"	Использование образца поликристаллического кремния с полусферическими зёрнами (HSG-Si) для оценки остроты иглы кантилевера
Сафарзаде А. А., НАА	Методы атомно-силовой микроскопии для исследований локально окислированных образований
Сдобняков Н. Ю., ТвГУ	О фрактальных свойствах наноразмерных пленок никеля, меди, хрома и титана: сравнительное исследование

Селезнева Е. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Роль катионного замещения в стабилизации суперпротонных фаз в кристаллах
Семенова Е. М., ТвГУ	Определение микромагнитных параметров одноосных ферромагнетиков по данным магнитно-силовой микроскопии
Синкевич А. И., ТвГУ	Применение аппарата фрактальной геометрии к исследованию наноструктуры и коэрцитивности гетерогенных сплавов SmCoCuFeZr
Чайка А. Н., ИФТТ РАН	Формирование нанокристаллов серебра на поверхности Si(557)
Щербакова Е. Н., БНТУ	Исследование липосом с тенекеплазой методом АСМ
Югай С. М., ИХФП АН РУз	Исследование композиций гидроксиапатита хитозана атомно-силовой микроскопией

Устные доклады Секция 4. Электронно-лучевая и ионная литографии

Докладчик	Название доклада
Артемов В. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Ионная литография кремниевых Фурье-метаповерхностей для оптического диапазона
Асадчиков В. Е., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Микроструктуры на основе регулярных трековых мембран и их оптические применения
Казьмирук В. В., ФГБУН ИПТМ РАН	Выбор оптимальной стратегии электронного экспонирования шаблонов структур с технологической нормой 65 нм.
Медведская П. Н., БФУ им. И. Канта	Ионно-лучевая литография для приложений когерентной рентгеновской оптики

Стендовые доклады Секция 4. Электронно-лучевая и ионная литографии

ФИО докладчика	Название доклада
Курганов И. Г., ИПТМ РАН	Система позиционирования электронного пучка в электронном литографе
Румянцев А. В., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Особенности распыления диоксида кремния при бомбардировке фокусированным пучком ионов галлия
Савицкая Т. Н., ИПТМ РАН	Повышение разрешающей способности электронно-оптических систем (ЭОС)
Уткин Д., ИФП СО РАН	Формы частиц Ge и Si созданных на поверхности SiO ₂ методами электронной и обратной литографии

Устные доклады Секция 5. Электронно-лучевые технологии в микроэлектронике

Докладчик	Название доклада
-----------	------------------

Стендовые доклады Секция 5. Электронно-лучевые технологии в микроэлектронике

ФИО докладчика	Название доклада
Князев М. А., ИПТМ	Электрические свойства графеноподобных пленок, селективно выращенных на предварительно облученных низкоэнергетичными электронами подложках Si/SiO ₂ Максим Князев, Дарья Седловец, Олег Солтанович и Сергей Ковешников
Привезенцев В. В., ФГУ "ФНЦ НИИСИ РАН"	РЭМ, АСМ и ОЭС исследование кварца, имплантированного Zn, для применения в мемристорах
Шакирова А. А., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Исследование передачи энергии возбуждения от тербия к европию в керамике на основе кубического ZrO ₂

Устные доклады Секция 6. Рентгеновская кристаллооптика

Докладчик	Название доклада
Аргунова Т. С., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Диагностика микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения в синхротронном излучении
Бузмаков А. В., ФНИЦ КиФ РАН	Новый метод математической реконструкции в рентгеновской микротомографии для исследования изменяющихся объектов.
Кочарян В. Р., ИППФ НАН РА	Управление параметров отраженного пучка жесткого рентгеновского излучения кристаллом кварца при наличии Внешних воздействий
Ломов А. , ФТИАН им. К.А. Валиева РАН	Особенности диагностики термомиграционных р-каналов в кремнии методом трехкристальной рентгеновской дифрактометрии в геометрии Брэгга
Михайленко М. С., ИФМ РАН	Изучение ионного распыления монокристаллического кремния с целью формирования рентгенооптических элементов
Поляков С. Н., ГНЦ РФ ТИСНУМ	Рентгенодифракционные методы исследования синтетических алмазов, предназначенных для изготовления элементов рентгеновской оптики
Пуногов В. И., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Лауэ дифракция пространственно ограниченных рентгеновских пучков в периодических структурах
Рощупкин Д. В., ИПТМ РАН	Исследование распространения поверхностных и псевдоповерхностных акустических волн в кристаллах LiNbO_3 и LiTaO_3 методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии
Смирнова И. А., ИФТТ РАН	Рентгеновский дифракционный интерферометр с одной щелью: численное моделирование и аналитика
Сороковиков М. Н., ФГАОУ ВО БФУ им.И.Канта	Планарная преломляющая оптика на основе кремния для источников рентгеновского излучения: метрология и совершенствование методов изготовления
Суворов Э. В., ИФТТ РАН	Особенности формирования деформационных полос в кристаллах
Труни К. Г., ИППФ НАН РА	Динамическая дифракция плоских рентгеновских волн в кристаллах ADP под влиянием температурного градиента

Стендовые доклады Секция 6. Рентгеновская кристаллооптика

ФИО докладчика	Название доклада
Дрмеян Г. Р., ИППФ НАН РА	Экспериментальное Исследование Тонкой Структуры Рентгенодифракционных Картин, Полученных от Двухблочных Кристаллических Систем с Недифрагирующей Зоной
Иванов И. В., НГТУ	Модифицированные методы профильного анализа результатов дифракции синхротронного излучения для анализа дефектной структуры поликристаллических твердых тел
Мехрабова М. А., Институт Радиационных Проблем НАНА	Влияние γ -излучения на кристаллическую структуру эпитаксиальных пленок $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Se}^1$
Рощин Б. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Устройство монохроматора для характеристики параметров двумерных энергодисперсионных рентгеновских детекторов
Скандаков Р. Н., ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Определение оптических постоянных в области резонансного фотопоглощения на примере фуллерита C_{60}

Устные доклады Секция 7. Многослойная оптика для рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазона

Докладчик	Название доклада
-----------	------------------

Гарахин С. А., ИФМ РАН	Измерения абсолютных значений интенсивности излучения в диапазоне длин волн 6,6-32 нм мишени из нержавеющей стали при импульсном лазерном возбуждении ("аннотация")
Перекалов А. А., ИФМ РАН	Исследование абсолютных интенсивностей эмиссионных линий газоструйных мишеней
Чернышев А. К., ИФМ РАН	Программа коррекции локальных ошибок формы малоразмерным ионным пучком на основе матричного алгоритма

Стендовые доклады Секция 7. Многослойная оптика для рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазона

ФИО докладчика	Название доклада
Мохов Д. В., Алферовский университет	Сглаживание профиля и полирование поверхности рентгеновской дифракционной Si-решетки треугольного профиля
Плешков Р. С., ИФМ РАН	Синтез и изучение свойств многослойных зеркал Cr/Be для диапазона жесткого рентгеновского излучения

Устные доклады Секция 8. Применение рентгеновской оптики для исследования микро- и наноструктур

Докладчик	Название доклада
Горай Л. И., ИАП РАН	Пути использования Si-решеток-подложек с блеском для работы в различных диапазонах спектра – от экстремального ультрафиолета до жесткого рентгена
Нечай А. Н., ИФМ РАН	Импульсный жидкоструйный лазерно - плазменный источник МР и ЭУФ излучения
Фещенко Р. М., ФИАН	Параболическое уравнение в задачах рентгеновской оптики
Фоломешкин М. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Нанофокусировка синхротронного излучения с использованием адиабатической преломляющей линзы

Стендовые доклады Секция 8. Применение рентгеновской оптики для исследования микро- и наноструктур

ФИО докладчика	Название доклада
Бусаров А. С., ФИАН	Оптические преобразования с нормально и наклонно расположенными объектами
Можчи́ль Р. Н., ИФТТ РАН	X-ray photoelectron spectroscopy of molecular porphyrin metallocomplexes with different f-states occupation

Устные доклады Секция 9. Рентгеновская микроскопия и томография

Докладчик	Название доклада
Асадчиков В. Е., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Многомасштабное исследование структуры полилактидов
Бушуев В. А., МГУ имени М.В. Ломоносова	Статистическая теория формирования рентгендифракционного фазового контраста
Золотов Д. А., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Новые подходы к решению задачи визуализации дефектов в монокристалле кремния по данным рентгеновской дифракционной томографии
Подурец К. М., НИЦ "Курчатовский институт"	Вглубь времен с синхротронной и нейтронной визуализацией
Реунов Д. , ИФМ РАН	Высокоразрешающий зеркальный рентгеновский микроскоп на

	длину волны 13.88 нм.
Чукалина М. В., ФНИЦ Кристаллография и фотоника	Совмещение изображений в задаче формирования мультиспектрального изображения из полутонных, собранных в различных экспериментальных условиях

Стендовые доклады Секция 9. Рентгеновская микроскопия и томография

ФИО докладчика	Название доклада
Дьячкова И. Г., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Рентгено-дифракционные исследования дислокационных структур в монокристаллическом кремнии
Золотов Д. А., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Формирование двойного изображения в полихроматическом излучении в лауэ-геометрии дифракции
Кривонос Ю. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Определение морфологических параметров пористых керамических мембран методом рентгеновской микротомографии
Попов Н. Л., ФИАН	Птихография

Устные доклады Секция 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

Докладчик	Название доклада
Баранников А., БФУ им. И.Канта	Лабораторный комплекс для тестирования рентгеновской оптики и адаптации синхротронных методов исследования.
Баулин Р. А., МГУ	Кластерно-слоистые структуры [Fe/Cr] исследуемые методами GISAXS и синхротронной мессбауэровской рефлектометрии
Вишняков Е. А., ФИАН	MgF ₂ однолинзовый монохроматор на область спектра 115-140 нм
Кон В. Г., НИЦ КИ	Пределы нанофокусировки синхротронного излучения с помощью составной преломляющей линзы
Мальшев И. В., ИФМ РАН	Проект станции «Наноскопия в окне прозрачности воды» для синхротрона СКИФ
Некпелов С. В., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Рентгеноспектральные исследования титанатов кальция-меди, допированных атомами 3d-металлов.
Петрова О. В., ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Исследования карбонат-замещенного апатита кости методами ультрамягкой рентгеновской спектроскопии поглощения
Сивков В. Н., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Исследование структуры и химического состава нанокompозитов на основе графитизированных природных материалов и углеродных нанотрубок.

Стендовые доклады Секция 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

ФИО докладчика	Название доклада
Скоркин В., ИЯИ РАН	Исследование металл-полимерных композитов с помощью лабораторных источников рентгеновского и бета излучений